

Вимоги до технічних характеристик та базової комплектації

Параметр	Одиниця вимірювання	Показатели	Mahr MarSurf LD 260	Accretch Surfcom CREST	Mitutoyo Formtracer Extreme CS-H5000CNC S	Hommel-Etamic Nanoscan (JENOPTIK)
Контроль контуру		Вимірювання радіусів, кутів, відстані, координат, підгонка ступеня регресії кіл, дуг кіл. Визначення точок, кіл і ділянок кіл, багаторазові вимірювання, подвійні контури, в тому числі асферичних поверхонь	Вимірювання радіусів, кутів, відстані, координат, підгонка ступеня регресії кіл, дуг кіл. Визначення точок, кіл і ділянок кіл, багаторазові вимірювання, подвійні контури, в тому числі асферичних поверхонь	Вимірювання радіусів, кутів, відстані, координат, підгонка ступеня регресії кіл, дуг кіл. Визначення точок, кіл і ділянок кіл, багаторазові вимірювання, подвійні контури, в тому числі асферичних поверхонь	Вимірювання радіусів, кутів, відстані, координат, підгонка ступеня регресії кіл, дуг кіл. Визначення точок, кіл і ділянок кіл, багаторазові вимірювання, подвійні контури, в тому числі асферичних поверхонь	Вимірювання радіусів, кутів, відстані, координат, підгонка ступеня регресії кіл, дуг кіл. Визначення точок, кіл і ділянок кіл, багаторазові вимірювання, подвійні контури, в тому числі асферичних поверхонь
Контроль шорсткості		R і W по ISO4287	R і W по ISO4287	R і W по ISO4287	R і W по ISO4287	R і W по ISO4287
Довжина ділянок оцінювання	мм	не менше 200	від 0,1 до 260	від 0,01 до 200 мм	від 0,01 до 200 мм	від 0,1 до 200 мм
Швидкість позиціонування	мм/с	від 0,02 до 200	від 0,02 до 200	від 0,02 до 200	від 0,02 до 200	від 0,05 до 10
Швидкість вимірювання контуру	мм/с	від 0,02 до 10	від 0,02 до 10	від 0,02 до 20	від 0,02 до 2	від 0,05 до 5
Швидкість вимірювання шорст-ті	мм/с	від 0,1 до 0,5	від 0,1 до 0,5	від 0,03 до 3	від 0,02 до 0,2	від 0,1 до 5
Діапазон вимірювання по Z:	мм	до 25	26 мм	26 мм	24 мм	24 мм
Не визначенність по осі X, не більше	мкм	$\pm(0,2+1/1000)$	$\pm(0,2+1/1000)$	$\pm(0,2+1/1000)$	$\pm(0,16+0,001L)$	$\pm(0,2+1/1000)$
Не визначенність по осі W, не більше	мкм	$\pm(0,2 + 1/250)$	$\pm(0,2 + 1/250)$	$\pm(0,2 + 1/1000)$	$\pm(0,07+0,02H)$	$\pm(0,2 + 1/250)$
Межі абсолютної похибки вимірювань довжини МРЕЕА, не більше	мкм	$\pm(1 + 1/150)$	$\pm(1 + 1/150)$ МРЕЕА	$\pm(0,5 + 1/150)$ МРЕ	Не указано	Не указано
Межі основної відносної допустимої похибки приладів при вимірюванні параметрів шорсткості Ra, Rz, Rmax	%	не більше 3 для Rz більше 5 мкм для Ra більше 0,75 мкм	2% \pm 2 для Rz більше 5 мкм для Ra більше 0,75 мкм	2% \pm 2 для Rz 5 мкм для Ra більше 0,75 мкм	2% \pm 2 для Rz 5 мкм для Ra більше 0,75 мкм	2% \pm 2 для Rz 5 мкм для Ra більше 0,75 мкм
Дозвіл по параметру Rz (власний шум)		При швидкості: 0,1 мм/с Rz \leq 20 нм; 0,5 мм/с Rz \leq 25 нм; 1,0 мм/с Rz \leq 40 нм	При швидкості: 0,1 мм/с Rz \leq 20 нм; 0,5 мм/с Rz \leq 25 нм; 1,0 мм/с Rz \leq 40 нм	Не залежить від швидкості Ra \leq 2 нм Rz \leq 10 нм	Не указано	Не указано
Межі абсолютної похибки вимірювань радіусу, мкм, не більше		Для R \leq 10 мм \pm 1 мкм Для 10 <R \leq 300 мм $\pm(0,17+R/12)$ мкм Для R>300 мм $\pm(18+ R/7)$	Межі абсолютної похибки вимірювань радіусу, мкм, не більше \pm 1 мкм	Не указано	Не указано	Не указано

		мкм				
Роздільна здатність вимірюваних осей	нм	0,8	0,8	0,31 0,54	0,0008мкм	0,6нм
Діапазон вимірювального зусилля	мН	Не більше 30 , регулюється програмно	от 0,5 до 30 , регулюється програмно	0,75	4 0,75	0,5-50
Електроживлення	V	230	230	230	230	230
Діапазон робочих температур	°C	Від +15 до +35 (рекомендована 20 °C ±2°C)	230	230	230	230
Температура зберігання	°C	від 0 до 40 (в транспортній упаковці)	Від +15 до +35 (рекомендована 20 °C ±2°C)	Від +15 до +35 (рекомендована 20 °C ±2°C)	Від +15 до +35 (рекомендована 20 °C ±2°C)	Від +15 до +35 (рекомендована 20 °C ±2°C)
Програмне забезпечення		Наявність спеціального програмного забезпечення для вимірювання сферичних, асферичних і конічних поверхонь. Наявність спеціального програмного забезпечення для статистичної обробки даних.	Наявність спеціального програмного забезпечення для вимірювання сферичних, асферичних і конічних поверхонь.	Наявність спеціального програмного забезпечення для вимірювання сферичних, асферичних і конічних поверхонь.	Наявність спеціального програмного забезпечення для вимірювання сферичних, асферичних і конічних поверхонь.	Наявність спеціального програмного забезпечення для вимірювання сферичних, асферичних і конічних поверхонь.
Повинен бути оснащений двостороннім щупом для сканування верхнього і нижнього контурів оптичних деталей		+	+	Нет	Не указано	Не указано
Можливість замовлення за спеціальним запитом спеціального пристосування для двостороннього виміру сферичних і асферичних лінз з наданням відповідних креслень кожної лінзи		+	+	+	+	+
Повинно бути передбачено магнітне кріплення		+	+	+	+	+
Відстеження допусків		+	+	+	+	+
Імпорт даних профіля (наприклад з DXF)		+	+	+	+	+
Експорт даних в Q-DAS gs-STAT		+	+	+	+	+
Розрахунок між профілями і видача корегувального файлу для оброблювального обладнання фірми Opto Tech		+	+	+		
Наявність кругового автоматичного столу для вимірів асферичних поверхонь в об'ємному зображенні		+	+	+	+	+